

S8000 FE-SEM 的优点

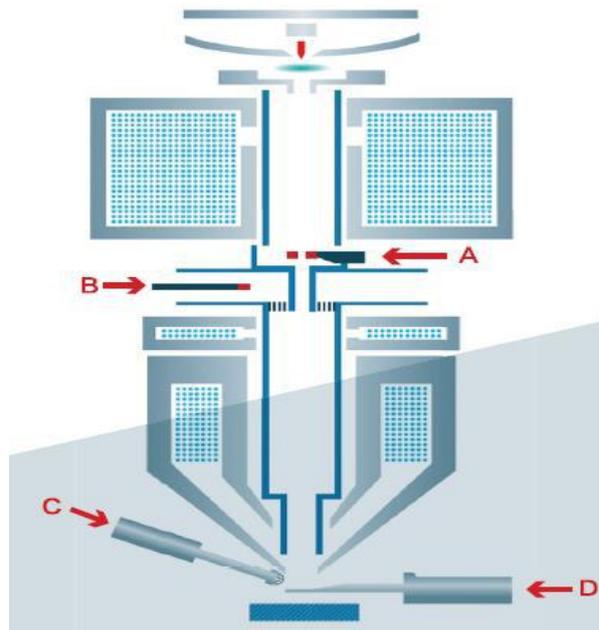
新一代镜筒内电子加速、减速技术，保证了复杂样品的低电压高分辨观测能力
首次配置的静电-电磁复合物镜，物镜无磁场外泄，实现磁性样品高分辨成像及分析
配置 4 个新一代探测器，可实现 9 种图像观测，对样品信息的采集更加全面
配置大型样品室，有超过 20 个扩展接口，为原位观测、分析创造了良好的工作环境
可以配置 TESCAN 自有或第三方的多种扩展分析附件，如 EDS、EBSD、CL、EBL，并独家实现与 Raman 联用



创新的电子光学镜筒，使电镜拥有更加出色的超高分辨率

TESCAN S8000 配置了最新的 BrightBeam™镜筒，实现了无磁场超高分辨成像，可以最大化的实现各种分析，包括磁性样品的分析。新型镜筒中的电子光路设计增强了低能量电子成像分辨率，特别适合对电子束敏感样品和不导电样品的分析。

另外，EquiPower™透镜技术可有效减少能量损耗并保证电子镜筒的稳定性。



BrightBeam™电子光学镜筒及探测器系统

- (A) Axial detector (In-Beam)
- (B) Multidetector (In-Beam)
- (C) E-T detector (In-Chamber)
- (D) Retractable BSE (In-Chamber)

配备最新的多种探测器，更好的表面灵敏度和对比度

S8000 可配置最新的多种探测器，包括透镜内 Axial detector 以及 Multidetector，可选择不同角度和不同能量来收集信号，体现更多种类的信息，同时获得更好的表面灵敏度和对比度。